

# 铁合金X射线衍射分析 铝合金屈服强度检测

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 铁合金X射线衍射分析 铝合金屈服强度检测                 |
| 公司名称 | 广分检测认证有限公司                           |
| 价格   | .00/件                                |
| 规格参数 | 检测范围:铁合金X射线衍射分析<br>周期:3-5<br>服务范围:全国 |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋              |
| 联系电话 | 18662582169 18662582169              |

## 产品详情

### 1、场发射透射电子显微分析（FE-TEM）：

主要用于金属、半导体、陶瓷以及各种纳米材料的研究和技术开发，用于观察分析以上固体物质和材料的微观形貌/尺寸、晶体结构和相组织，及其相应微区化学成分的定性和半定量分析等。面向材料科学、化学、物理学、地质学、生物学、医学、环境科学等领域的科学研究。

检测参数：（1）透射电子明场成像、（2）暗场成像、（3）扫描透射成像、（4）选区电子衍射、（5）高分辨成像、（6）点/线/面的能谱分析、（7）样品制备：精密切割、精密减薄、离子减薄、凹坑、离子溅射、超声分散等。

### 2、场发射扫描电子显微分析（FE-SEM）：

化学、物理学、材料科学、地质学、生物学、医学、环境科学等领域关于金属、半导体、陶瓷、纳米材料、功能材料、生物材料的研究和技术开发，用于观察分析以上固体物质料的表面形貌、组织、取向及成分。

检测参数：（1）二次电子形貌像、（2）被散电子衬度像、（3）背散射电子物相分析与相鉴定、（4）能谱元素点、线、面成分评定；（5）样品制备：金、铂、铬碳膜的制备。

### 3、钨灯丝扫描电子显微分析（SEM）：

用于材料科学、地质学、化学、物理学、环境科学等领域的科学研究。主要面向金属及合金、半导体、陶瓷、矿物等的研究和开发，用于观察分析以上固体物质和材料的微观形貌/尺寸和相组织，及其相应微区化学成分的定性、半定量及定量分析。

检测参数：（1）二次电子形貌像、（2）被散电子衬度像、（3）能谱元素点、线、面成分评定；

#### 4、 电子探针显微分析 (EPMA)

用于化学、物理学、材料科学、地质学、环境科学等领域的科学研究。主要面向金属及合金、半导体、陶瓷、功能材料、催化剂的研究和技术开发，用于观察分析以上固体物质、矿物、药品和材料的显微组织及其相应微区化学成分的定量、半定量及定性分析。

检测参数：(1) 二次电子形貌像、(2) 被散电子形貌像、(3) 波谱元素点、线、面成分评定、(4) 能谱元素点、线、面成分评定；

#### 5、 X射线衍射分析 (XRD)

采用X射线衍射技术可以实现对粉末、块体、薄膜等样品开展连续测量、步进测量、掠入射测量、小角衍射测量(0.3~10 $\theta$ )、高温衍射、微区衍射、小角散射、CT透射、薄膜反射率检测等功能，通过分析可获知材料定性定量组成、结晶化度、晶胞参数、晶型特征、纳米晶粒尺寸、微观应变、残余应力、织构、固溶、以及其他微结构信息，该技术被广泛应用于冶金、材料、矿物、化工、环工、生物、建筑、医疗、电子、机械、交通等众多领域。

功能与参数：(1) 连续测量、(2) 步进测量、(3) 薄膜掠入射测量、(4) 小角衍射测量(0.5~5 $\theta$ )、(5) 微区衍射测量、(6) 残余应力测量、(7) 小角散射、(8) 显微结构CT透射、(9) 原子对分布函数测量分析(PDF)、(10) X射线透射衍射测量；

#### 6、 X射线光电子(俄歇电子)能谱分析(XPS、AES)：

主要应用于金属材料、无机/有机材料、纳米材料、半导体材料、生物材料及环境材料等涉及材料表面(5-50 $\mu$ m)元素成分的定性、定量分析以及元素化学态的结构分析。仪器功能包括：XPS扫描、XPS成象、Ar<sup>+</sup>离子溅射、深度分析、角分辨等。采用X射线光电子能谱仪(XPS)或俄歇电子能谱仪(AES)对块体、粉末、分子筛等样品进行表面成分分析与元素价态表征，测试模式包括XPS宽谱扫描(0~1200eV)和窄谱扫描，AES宽谱扫描(50~2000eV)及窄谱扫描。可以做元素面扫描分析，可以配合Ar离子溅射得到元素在样品表面的深度分布，可对测试后的数据进行拟合分析得到元素价态等信息。

检测参数：(1) XPS宽扫描谱(0~1200eV)、(2) AES宽扫描谱(50~2000eV)(3) 窄扫描谱采集、(4) Ar离子深度溅射、(5) 元素面扫描分析、(6) XPS原子浓度分析、(7) AES原子浓度分析、(8) 化学价态分析；

#### 8、 波长色散X射线荧光光谱分析(WD-XRF)：

波长色散型X射线荧光光谱仪是利用原级X射线辐照待测物质中的原子，使之产生次级X射线(荧光)，进而对物质元素组成进行定性定量分析的仪器。该测试方法不破坏样品，分析速度快，适用于测定Be4-U92的所有化学元素，分析精度高，样品制备简单。

检测参数：(1) 定性成分分析、(2) 半定量成分分析、(3) 定量成分分析、(4) 其它分析；

#### 9、 密度、腐蚀速率、燃烧速率、粘度、闪点、燃点、磁场强度检测；

#### 10、 易燃、腐蚀、磁性等九类航空危险品物理化学性质鉴定、航空安全运输包装条件鉴定等；